

短周期 $(Ge)_n(Si)_m$ 应变超晶格电子结构 的自洽赝势计算*

范卫军 顾宗权†

半导体超晶格国家重点实验室

中国科学院半导体研究所, 北京 100083

(1992年6月23日收到)

在局域密度近似下, 用第一原理自洽赝势的方法计算了短周期超晶格 $(Ge)_n(Si)_m$ 和 $(Ge)_n(Si)_2$ 的能带结构。结果表明 $(Ge)_n(Si)_m$ 是间接带, 导带最低点在布里渊区的 \bar{X} 点。 $(Ge)_n(Si)_2$ 也是间接带, 导带最低点在布里渊区 \bar{M} 点附近。给出了禁带宽度及自旋轨道分裂值, 并与有关的理论和实验做了比较。

PACC: 7110, 7125C, 7340L.

1. 引言

最近以 Si 和 Ge_xSi_{1-x} 为衬底生长的短周期 $(Ge)_n(Si)_m$ 超晶格引起了人们的广泛注意^[1-8]。由于 Ge 和 Si 的晶格常数不相等, $(Ge)_n(Si)_m$ 超晶格层中产生应变。在不同的衬底上生长, 可以获得不同应变分布的 $(Ge)_n(Si)_m$ 超晶格。Gnutzmann 等人^[9]推测了由间接带的 Ge 和 Si 构成具有准直接带的 $(Ge)_n(Si)_m$ 超晶格的可能性。Pearsall 等人^[10]对 $(Ge)_n(Si)_m$ ($n = 1, 2, 4$) 进行了电反射率测量。Zachai 等人^[11]对 $(Ge)_n(Si)_m$ ($m + n = 10$) 超晶格进行了光致发光测量。在理论上, Schmid 等人^[12-14]用 LMTO 方法计算了 $(Ge)_n(Si)_m$ 的能带结构。Froyen 等人^[15]对 $(Ge)_n(Si)_n$ ($n = 1, 2, 4, 6$) 做了第一原理自洽赝势计算, 没有考虑自旋轨道分裂。本文在 LDA 近似下用第一原理自洽赝势方法计算了在 Si 衬底上生长的 $(Ge)_n(Si)_m$ ($n = 1, 2$) 超晶格的能带结构, 考虑了自旋轨道相互作用, 并与有关的理论和实验做了比较。

2. 计算方法及结果

取 Si 的晶格常数 $a_{Si} = 5.431 \text{ \AA}$, Ge 的晶格常数 $a_{Ge} = 5.657 \text{ \AA}$, 则晶格失配为 4.1%。计算中假设以 Si 材料为衬底, 应变只存在 Ge 层中。垂直于生长方向的平面内晶格常数 $a_{\perp} = a_{Si}$ 。沿生长方向的晶格常数 $a_{\parallel} = \frac{1}{2}(a_{Si} + a_{Ge})(1 + \delta)$, 通过总能极小求出 a_{\perp} 。 $(Ge)_n(Si)_m$ 具有 D_{2d} 点群对称操作。原胞基矢取为 $a_i = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) a_{\perp}$,

* 本工作得到中国科学院 LWTZ-1298 经费的资助。得到国家自然科学基金的资助。

$a_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) a_{\parallel}$, $a_2 = \left(0, \frac{a_{\parallel}}{2}, \frac{a_{\perp}}{2}\right)$, $a_{\perp} = 5.522 \text{ \AA}$. 单位原胞中有两个原子, 在 $a_1 a_2 a_3$ 坐标系中两原子的位置为: Ge(0, 0, 0); Si(0.25, 0.75, 0.5). 其布里渊区的特殊点和体材料的对应关系是: $\bar{X}(X_{x,y})$, $\bar{\Gamma}(\Gamma, X'_z)$, X'_z 为距离布里渊区中心 $\frac{2}{3} \frac{2\pi}{a_{\perp}}$ 处的点. $(Ge)_2(Si)_2$ 具有 D_{2h} 点群对称操作, 其原胞基矢为 $a_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) a_{\parallel}$, $a_2 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) a_{\parallel}$, $a_3 = (0, 0, 1) a_{\perp}$, $a_{\perp} = 5.533 \text{ \AA}$. 单位原胞中有四个原子, 在 $a_1 a_2 a_3$ 坐标系中其位置为: Si(0, 0, 0), (0.5, 0, 0.2454); Ge(0.5, 0.5, 0.4954), (0, 0.5, 0.75). 其布里渊区的特殊点与体材料的对应关系是: $\bar{M}(X_{x,y})$, $\bar{R}(L)$, $\bar{\Gamma}(\Gamma, X_z)$.

计算中采用自洽赝势在动量空间的表示式^[10], 对交换相关势作局域密度近似(LDA)^[11]. 离子赝势根据 Hamann^[12] 的方法产生, 并包括了 Kleinman^[13] 的相对论修正. 采用Ceperly-Alder 交换相关势^[14]. 能带的本征函数通过平面波展开得到. 对 $(Ge)_1(Si)_1$ 超晶格平面波展开的动能截断为 $e_{\max} = 14.0 \text{ Ry}$, 例格矢的截断为 $G_{\max} = 7.0 \text{ au.}$; 对 $(Ge)_2(Si)_2$ 超晶格 $e_{\max} = 10.4 \text{ Ry}$, $G_{\max} = 6.4 \text{ au.}$ 对布里渊区 K 点积分是根据 Chadi^[15] 特殊点方法完成的. 对 $(Ge)_1(Si)_1$ 采用了 15 个特殊点; 对 $(Ge)_2(Si)_2$ 采用了 8 个特殊点. 自洽迭代总能收敛到 10^{-4} Ry .

由于局域密度近似造成能隙宽度比实验值小许多, 为此我们对计算的能隙加上一个修正项 ΔEg . $\Delta Eg = (\Delta Eg_{Ge} + \Delta Eg_{Si})/2$, ΔEg_{Ge} 和 ΔEg_{Si} 分别是 Ge 和 Si 的 Γ 点能隙的实验值与计算值之差. 计算 $e_{\max} = 15 \text{ Ry}$, $G_{\max} = 8.0 \text{ au.}$ 时 Si Γ 点能隙为

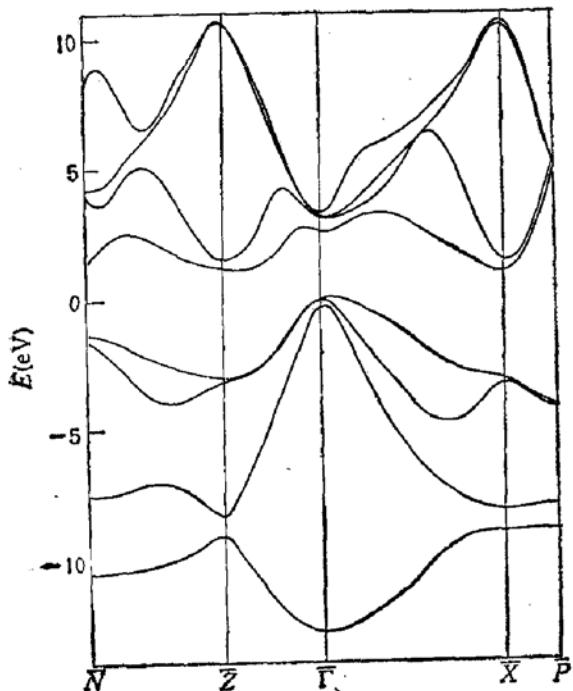


图 1 $(Ge)_1(Si)_1$ 应变超晶格的能带结构

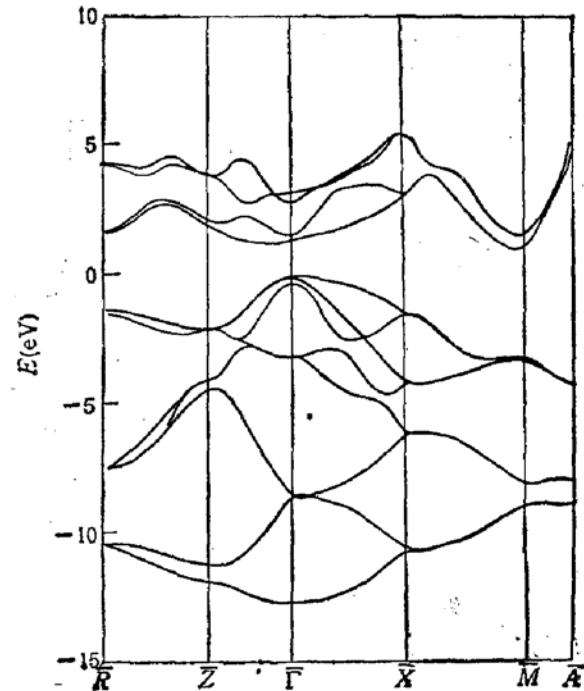


图 2 $(Ge)_2(Si)_2$ 应变超晶格的能带结构

2.495eV , $e_{\max} = 12\text{Ry}$, $G_{\max} = 7.0\text{au}$. 时 $\text{Ge}\Gamma$ 点能隙为 0.226eV . 取 Si 和 $\text{Ge}\Gamma$ 点能隙的实验值分别为 3.37eV 和 0.797eV . 则 $\Delta E_g = 0.72\text{eV}$.

图 1 和图 2 给出了 $(\text{Ge})_1(\text{Si})_1$ 和 $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 应变超晶格的能带结构图. 表 1 给出了应变和没有考虑应变(此时晶格常数取 Ge 和 Si 晶格常数的平均值)的能隙值和自旋轨道分裂值, 并列出了有关理论和实验结果. 括号中是没有经过修正的能隙宽度.

表 1 $(\text{Ge})_1(\text{Si})_1$ 和 $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 的能隙宽度和自旋轨道分裂的理论值和实验值(单位 eV)

n		$E_{g\Gamma}$	E_g	导带最低点位置	Δ_s
1	考虑应变	2.64(1.92)	1.13(0.41)	\bar{X}	0.13
	没考虑应变	2.23(1.51)	1.20(0.48)	$0.88\bar{X}$	0.18
	文献[6]结果	2.407	1.22	$0.87\bar{X}$	0.186
	实验结果	2.60	0.68		
2	考虑应变	1.38(0.66)	1.03(0.35)	$0.95\bar{M}$	0.11
	没考虑应变	1.39(0.67)	1.26(0.54)	$0.36\bar{Z}$	0.17
	文献[7]结果	1.36	0.90	$0.95\bar{M}$	
	实验结果	2.21	0.85		

从计算结果看出 $(\text{Ge})_1(\text{Si})_1$ 和 $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 都是间接带。 $(\text{Ge})_1(\text{Si})_1$ 的导带最低点在 \bar{X} 处。 $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 的导带最低点在 Γ 点到 \bar{M} 点距离的 0.95 处, 记作 $0.95\bar{M}$. 表 1 中所列文献[6]的计算结果没有考虑应变。我们也计算了没有考虑应变的情况。从表 1 可以看出 $n = 1$ 时不考虑应变我们的结果同文献[6]的结果符合很好。表 1 中文献[7]的结果考虑了应变, 与我们的计算结果相比符合很好。但计算结果和文献[4]的实验结果符合不好。以 $n = 1$ 的 E_g 为例, 实验值与理论值相比小了将近一半。我们认为造成这样的原因是实验中测得的很可能是 GeSi 合金而不是超晶格的 E_g . Pearsall^[4] 在分析其实验结果时指出了这一点。不考虑应变时, 由 Ge 和 Si 构成的闪锌矿结构的体材料(即 $(\text{Ge})_1(\text{Si})_1$ 的情况), 布里渊区的三个 X 点 (X_x, X_y, X_z) 是等价的。计算得到导带最低点在 $0.88\bar{X}$ 处。当 Ge 和 Si 构成 $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 超晶格时, 布里渊区在生长方向 (z 方向)发生折叠。原体材料 X_z 附近的导带最低点折叠到 Γ 点附近, 即在超晶格布里渊区的 $0.36\bar{Z}$ 处, 其能级相对价带顶的值为 1.26eV , 而计算的 $\bar{M}(X_x, X_y)$ 附近的导带极小值点相对价带顶的值为 1.33eV , 二者数值相近。应变后, $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 的 $\bar{M}(X_x, X_y)$ 附近的导带极小值点的能级位置下降较大, 成为导带的最低点, 位于 $0.95\bar{M}$.

3. 结论

从本文对生长在 Si 衬底上的 $(\text{Ge})_n(\text{Si})_n$ ($n = 1, 2$) 超晶格的电子结构的自洽赝势计算中可以得出以下结论:

$(\text{Ge})_n(\text{Si})_n$ ($n = 1, 2$) 超晶格具有间接带; $(\text{Ge})_1(\text{Si})_1$ 的导带最低点在 \bar{X} 处, 禁带宽度为 1.13eV ; $(\text{Ge})_2(\text{Si})_2$ 的导带最低点在 $0.95\bar{M}$ 处, 禁带宽度为 1.03eV ; 两者的自旋轨道分裂值分别为 0.13eV 和 0.11eV .

参 考 文 献

- [1] T. P. Pearsall, J. Bevk, L. C. Feldman, J. M. Bonar, J. P. Mannaerts and A. Ourmazd, *Phys. Rev. Lett.*,

- 58, 729(1987).
- [2] M. S. Hybertsen, M. Schlüter, R. People, S. A. Jackson, D. V. Lang, T. P. Pearsall, J. C. Bean, J. M. Vandenberg and J. Bevk, *Phys. Rev.*, **B37**, 10195(1988).
- [3] E. Kasper, H. Kibbel, H. Jorke, H. Brugger, E. Friess and G. Abstreiter, *Phys. Rev.*, **B38**, 3599(1988).
- [4] T. P. Pearsall, J. Bevk, J. C. Bean, J. Bonar, J. P. Mannaert and A. Ourmazd, *Phys. Rev.*, **B39**, 3741(1989).
- [5] R. Zachai, K. Eberl, G. Abstreiter, E. Kasper and H. Kibbel, *Phys. Rev. Lett.*, **64**, 1055(1990).
- [6] U. Schmid, N. E. Christensen and M. Cardona, *Phys. Rev.*, **B41**, 5919(1990).
- [7] U. Schmid, N. E. Christensen, M. Alouani And M. Cardona, *Phys. Rev.*, **B43**, 14597(1991).
- [8] S. Froyen, D. M. Wood and A. Zunger, *Phys. Rev.*, **B37**, 6893(1988).
- [9] U. Gutzmann and K. Clausecker, *Appl. Phys.*, **3**, 9(1974).
- [10] J. Ihm, A. Zunger and M. L. Cohen, *J. Phys.*, **C12**, 4409(1979).
- [11] P. Hohenberg and W. Kohn, *Phys. Rev.*, **B136**, 1864(1964); W. Kohn and L. J. Sham, *ibid.*, **140**, A1133(1965).
- [12] D. R. Hamann, M. Schlüter and C. Chiang, *Phys. Rev. Lett.*, **43**, 1494(1979).
- [13] L. K. Kleinman, *Phys. Rev.*, **B21**, 2630(1982); G. B. Bachelet and M. Schlüter, *ibid.*, **25**, 2103(1982).
- [14] D. M. Ceperley and B. J. Alder, *Phys. Rev. Lett.*, **45**, 566(1980).
- [15] D. J. Chadi, M. L. Cohen, *Phys. Rev.*, **B8**, 5747(1973).

Self-consistent Pseudopotential Calculation of the Electronic Structures of Short-period $(Ge)_n(Si)_n$ Strained Superlattices

Fan Weijun Gu Zongquan [†]

National Laboratory for Superlattice and Microstructure

†Institute of Semiconductors, Academia Sinica, Beijing 100083

(Received 23 June 1992)

Abstract

With the local density approximation, the band structures of the short-period $(Ge)_1(Si)_1$ and $(Ge)_2(Si)_2$ superlattices are calculated by using the first-principle self-consistent pseudopotential method. The results show that the $(Ge)_1(Si)_1$ superlattice is an indirect semiconductor, and the lowest conduction band state is at point \bar{X} in the Brillouin zone; the $(Ge)_2(Si)_2$ superlattice is indirect and the lowest conduction band state is near point \bar{M} . The energy gaps and the spin-orbit splitting values are calculated and compared with the theoretical and experimental results.

PACC: 7110, 7125C, 7340L.